编号：0097 -2016-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 涂层厚度测量过程 | | 被测参数要求(含公差) | (50～100)μm±5μm | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | 图纸、检验指导书 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  涂层厚度控制范围在(50～100)μm±5μm，   1. 测量过程最大允许误差：△允=T×1/3=10×1/3=3.3μm 2. 测量范围推导：(50～100)μm±5μm选择测量范围：设备量程应满足(20～200)μm 3. 选择膜厚计测量设备范围：(0～1000)μm   最大允许误差MPE：±(3+10%H)μm=3.2μm（H取200μm） | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准证书编号 | 检定日期 |
| 膜厚计/ NV-089 | | GTS812F | MPE：±(3+10%H) μm | | S029041-21 | 2021.12.07 |
|  | |  |  | |  |  |
| 计量验证记录  1、选择测量范围：膜厚计测量范围为(0--1000)μm，测量范围满足要求。  2、涂层厚度的测量最大允差△允为3.3μm。  测量设备的计量特性：膜厚计允许的最大误差为3.2μm（H=200μm）。  将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较3.2μm<3.3μm，满足测量过程的计量要求。  验证合格，符合要求。  验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项）  徐霖霖.jpg  验证人员签字： 验证日期：2021年12月28日 | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 2. 计量要求导出方法正确 3. 测量设备的配备满足计量要求 4. 测量设备已检定 5. 测量设备已验证     审核员签名：  蔡永军.jpg  企业代表签字： 审核日期：2022年3月12日 | | | | | | | |